

College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

محاكاة الطبقة الإمتصاصية CZTS في الخلية الشمسية مع طبقات نافذة وعازلة متباينة وبمعالم كهربائية مختلفة لتحقيق الأداء الأمثل

بشار علي محمد رمضان جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الفيزياء

(قدم للنشر في ۲۰۲۱/۲/۲ ، قبل للنشر في ۲۰۲۱/۳/۱۰)

الخلاصة:

تم في هذا البحث الإعتماد على الخلية الأساس MoS $_2$ /CZTS/CdS/i–ZnO/ZnO:AL التي تم تصميمها وكانت تم في هذا البحث الإعتماد على الخلية الأساس Joc =1.1074V ,Jsc= 29.5356 mA/cm 2 , FF=70.29%, η =23.00%).

SCAPS-1D وباستخدام برنامج المحاكاة Window Layers في هذه الدراسة تم إختبار الطبقات النافذة كان الطبقة النافذة كان Window Layers وباستخدام برنامج المحاكاة الطبقة النافذة كان (ZnO, SnO2, ZnO:AL) والمحتبار الطبقات العازلة المختلفة Buffer Layers الخلية الشمسية الأساس مثل ($(0.1 \mu m)$) كما تم إختبار الطبقات العازلة المختلفة عازلة، إذ تبين أن أفضل سُمك لتلك الطبقة العازلة كان ((2nS)). بعد الحداد كل من الطبقة النافذة والطبقة العازلة أصبحت الخلية المعدلة/(2nS) كان ((2nS)) عندها أصبحت مخرجات مخرجات الخلية الإمتصاص فيها وتبين أن أفضل سُمك لطبقة الإمتصاص ((2nS)) كان ((2nS)) عندها أصبحت مخرجات الخلية ((2nS)) كان ((2nS)) عندها أصبحت مخرجات الخلية ((2nS)) كان ((2nS)) عندها أصبحت مخرجات الخلية ((2nS)) كان ((2nS)) كان ((2nS)) عندها أصبحت مخرجات الخلية ((2nS)) كان ((2nS)

الكلمات الدالة: الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، الخلية الشمسية(CZTS)، البرنامج الحاسوبي CAPS-1D.



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

Simulation the Absorbance Layer CZTS in Solar Cell for Varying Windows and Buffer Layers for Different Electrical Parameters to Achieve Optimum Performance

Bashar A. Mohammed Raad A.Rasool University of Mosul/Education College of Pure Science/Physics Department

Abstract:

In this research, we rely on the base cell $MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$, which was designed and its outputs are (Voc=1.1074V, Jsc=29.5356 mA/cm², FF=70.29%, η =23.00%).

In this study, Windows layers were tested using simulation programmed SCAPS-1D about layers (ZnO, SnO₂, ZnO:AL), where (ZnO:AL) was selected as window layer, and it was found that the best thickness of the windows layer (0.1 μ m). Also the different Buffer layers of the basic solar cell (CdS, ZnO, ZnS, ZnSe, In₂S₃) were tested, where (ZnS) was selected as the Buffer layer, where it was found that the best thickness was (0.12 μ m).

After adopting both the window layers and Buffer layers, the modified cell became $MoS_2/CZTS/ZnS/i-ZnO/ZnO:AL$, the thickness of the Absorption layer was tested, and it was found that the best thickness of the Absorption layer (CZTS) was (1.5µm), then the cell output (Voc = 1.0596V, Jsc=28.1390 mA/cm², FF= 88.41%, n=26.37%).

Key words: Thin Film Solar Cell, CZTS Solar Cell, SCAPS-1D Computer Software.

المقدمة:

مع زيادة الإستهلاك للطاقة التقليدية والأزمة البيئية الخطيرة تدريجياً، فقد أجتذب البحث عن الخلايا الشمسية وتطبيقاتها اهتماماً عالمياً متزايداً [1]. في السنوات العشر الماضية عزّز تقدم تقنية تحضير الأغشية الرقيقة من إزدهار تكنولوجيا الجيل الثاني من الخلايا الشمسية القائمة على مواد رقيقة من أشباه الموصلات. نظراً للطلب على مواد أقل فأنه يمكن لتقنية الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة أن تقلل بشكل فعال من المواد، علاوة على ذلك يمكن لمواد الأغشية الرقيقة أن تترسب بمرونة على ركائز مثل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستك وهي مناسبة بشكل خاص لتكامل الخلايا الشمسية. تشمل الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة الرئيسية غشاء السيليكون الرقيق غير المتبلور، والكادميوم تيلورايد (CdTe)، والسيلينيوم النحاسي والإنديوم الغاليوم (Cigs)، وزنيخيد الغاليوم، ونحاس الزنك والكبريت والقصدير (Cu2ZnSnS₄) فيما يلي يشار إليها بإسم (CZTS)، حيث يحتوي زرنيخيد الغاليوم والكادميوم تيلورايد على عناصر سامة (الكادميوم والزرنيخ)، وبحتوي نظام سيلينيد الإنديوم والنحاس على عناصر إنديوم نادرة.

College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

أن (CZTS) عبارة عن مركبات رباعية من هيكل ستانيت، تبلغ فجوة الطاقة فيه حوالي (1.5 V) وهي قريبة جداً من فجوة الطاقة الأفضل التي تتطلبها الخلايا الشمسية شبه الموصلة (1.35 V)، كما أن(CZTS) هي مادة أشباه موصلات ذات فجوة طاقة مباشرة مع معامل امتصاص عالي وهيكل متعدد الطبقات، لذلك يمكن استخدامه كطبقة إمتصاص للخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة. مقارنة بالسيليكون البلوري المتداول حالياً CIGS و CZTS، نظراً لوفرة العناصر المكونة في القشرة الأرضية، تعد الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة غير السامة والصديقة للبيئة CZTS واحدة من أفضل المواد المرشحة لطبقة إمتصاص الطاقة الشمسية [2,3]. وهو أمر متوقع لتصبح مادة طبقة الإمتصاص المثالية للجيل القادم من الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة.

تم إنشاء الخلايا الشمسية CZTS لأول مرة في عام 1966 [4]، ثم تبين لاحقاً أنها تعرض للتأثير الكهروضوئي في عام 1988 [5]، وقد تمت زيادة كفاءة الخلايا الشمسية في CZTS إلى 5,7%، وفي عام 2005 تم تحسين عملية الترسيب [6].

في عام 1988 إستخدم كل من Ito و Nakazawa في جامعة شينشو اليابانية طريقة الرش لتصنيع خلية (CZTS) لأول مرة. قاموا بتصنيع الخلية (CZTS) برش حزمة ذرية والحصول على الخلية (CZTS) بفجوة طاقة قدرها (1.45V). وبعد تشكيل وصلة غير متجانسة مع (CdZnO) حصلوا على خلية شمسية بجهد دائرة فتح بلغ (165mV) [7].

في عام 1996 أستخدم مجموعة من الباحثين في 1996 استخدم مجموعة من الباحثين في Group وبطريقة التبخير الإشعاعي الإلكتروني وطريقة المعالجة لتصنيع الخلايا الشمسية لهيكل الخليلييية Group وبطريقة التبخير الإشعاعي الإلكتروني وطريقة المعالجة لتصنيع الخلايا الشمسية لهيكل الخليلييية Group وعامل المليء ZnO-AL/CdS/CZTS/Mo/SLG وبجهد دائرة الفتح (400mV) وتيار دائرة القصر (0.66%) وكفاءة تحويل (0.66%) [8].

في عام 2011 درس Ito في جامعة شينشو طريقة رش المواد الأولية المعدنية من النحاس والقصدير والزنك لتصنيع (CZTS) وحصل على كفاءة (3.7%) [9].

المواد وطرق عمل المحاكاة:

برنامج الـ (SCAPS) هو محاكاة عددية لهياكل أشباه الموصلات للخلايا الشمسية الرقيقة (CZTS) القائمة على برنامج الـ (Cu₂ZnSnS₄)، وقد تم تطويره في قسم الإلكترونيات ونظم المعلومات (ELIS) من جامعة كينت في بلجيكا، ساهم في تطويره عدد من الباحثين وهم كلاً من كوبن ديكوك ومارك بوركلمان و أليكس نيميكيرز وستيفان ديكريفDegrave [10].



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

البرنامج متاح مجاناً لمجتمع البحوث الكهروضوئية (الجامعات ومعاهد البحث). إذ تم تطوير البرنامج في الأصل لتركيبات خلايا (CulnSe₂) وعائلة (CdTe)، بحيث يعمل على الخلايا الشمسية البلورية (GaAs وعائلة (CdTe)، بحيث يعمل على الكمبيوتر الشخصي بنظام Windows 95، ويعمل على الكمبيوتر الشخصي بنظام 35 Windows 95، ويعمل على الكمبيوتر الشخصي بنظام 45 Giffusion equation والإنجراف (SCAPS) هو معادلة الإنتشار bdiffusion equation والإنجراف (SCAPS) هو معادلة الإستمرارية ويمكن الإستمرارية Equality equation ويمكن الفحون، ويمكن الخلية الشمسية من خلال محاكي SCAPS تحت الظروف المحددة من قبِل الباحث K.wok وهذه المعادلات هي على النحو الآتي[11].

$$Jn = q\mu n \, n\mathcal{E} + qDn \frac{dn}{dx} = q\mu n \left(n\mathcal{E} + \frac{KT}{q} \frac{dn}{dx} \right) = nn \frac{dEFn}{dx} \quad \cdots \cdots (1)$$

$$Jp = q\mu pP\mathcal{E} + qDp\frac{dp}{dx} = q\mu p\left(P\mathcal{E} + \frac{KT}{q}\frac{dp}{dx}\right) = \mu pP\frac{dEFp}{dx} \dots \dots \dots (2)$$

Electric Field (V/cm) حيث ε – تمثل المجال الكهربائي

.The Ability of Electron's and Hole's $(cm^2/V-s)$ والتحركية نسبة للإلكترونات والفجوات – μn , μp

Jn, Jp تمثل كثافة التيار نسبة للإلكترونات والفجوات Jn, Jp مثل كثافة التيار نسبة للإلكترونات والفجوات (mA/cm²).

Diffusion Coefficient for Electron's and Hole's (cm 2 /s) والمجاول الإنتشار للإلكترونات والفجوات –Dn, DP

ويمكن كتابة معادلة الإستمرارية نسبة للإلكترونات وهي:

- Gn(x) حيث - Gn(x) مثل عملية التولد للإلكترونات

تمثل عملية معدل إعادة التركيب ومعادلة الإستمرارية نسبة للفجوات: -Rn(x)



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

حيث - Gp(x) حيث حملية تولد الفجوات - Generation Process of Hole's

.Mean Recombination تمثل معدل إعادة التركيب - Rp(x)

أما معادلة بواسون poisson's equation فهي تربط بين معادلة كثافة الشحنات وجهد الإلكترونات (الجهد الكهروستاتيكي Φ)، وهي نقطة بداية في الحصول على الحل النوعي للمتغيرات في الكهربائية الساكنة في أشباه الموصلات [11].

$$\frac{\mathrm{d} \ln(\mathrm{E}(\mathrm{x}))}{\partial \mathrm{x}} \cdot \frac{\mathrm{d}\Phi(\mathrm{x})}{\mathrm{d}\mathrm{x}} + \frac{d2\Phi}{dx^2} = \frac{\rho(\mathrm{x})}{\mathcal{E}_{\circ}(X)} \quad \dots \dots \dots (5)$$

وفي حالة ثبات (arepsilon) تكون معادلة poisson's equation بالصيغة الآتية:

.Electron Permittivity (F/cm) إذ إن $-\varepsilon$ تمثل السماحية الكهربائية

ويمكن حساب التيار الذي يمر عبر الخلية الشمسية من خلال المعادلة:

حيث I – تيار دائرة الحمل، أما I_0 – يمثل تيار التشبع العكسي، و T تمثل درجة الحرارة و I_0 – تمثل ثابت بولتزمان Boltzmann constant ، ويمكن حساب فولتية الدائرة المفتوحة (V_{oc}) من العلاقة الآتية:

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} In \frac{I_{SC}}{I_o} + 1$$
(8)

عامل المليء Fill Facter يمكن تعريفه بأنه تربيع المنحني (I-V) ويرتبط مقداره بشكل رئيسي في خسارة المقاومة للخلية الشمسية ، وبمكن حسابه من العلاقة الآتية:

نحسب أيضاً كفاءة الخلية الشمسية من العلاقة:

$$\eta = \frac{OutPut\ Power(P_{out})}{InPut\ Power(P_{in})} \times 100\% \qquad \dots \dots (10)$$



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

ويمكن كتابة معادلة الكفاءة بطريقة أخرى

في البدء تم إختبار الخلية الأساس $MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$ باستخدام برنامج الـ $MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$ مبين في الشكل (١) الذي يمثل طبقات الخلية شكلياً من خلال البرنامج، وكانت مخرجات هذه الخلية بعد تطبيق واجهة Voc=1.1074V, Jsc=29.5356 mA/cm^2 , FF=70.29%, $\eta=23.00\%$



الشكل(١) يوضح طبقات الخلية الأساس

إذ يبين الجدول(1) معلمات الطبقات الخاصة بالخلية الأساس وهي كلا من: الطبقة الخلفية MoS₂) Back Layer إذ يبين الجدول(1) معلمات الطبقات الخاصة بالخلية الأساس وهي كلا من: الطبقة الموصلة الشفافة(CZTS) Absorption Layer والطبقة النافذة ZnO:AL) Window Layer).

electron والألفة الإلكترونية thickness والسُمك band gap (E_g) والكترونية والكترونية وتتمثل هذه المعلمات كلاً من: فجوة الحزمة (χ) affinity electron affinity السماحية العازلة (χ) affinity electron affinity



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

acceptor density (N_D) ، تحركية الثقوب (donor density (N_A) كثافة الواهب (hole mobility (μ_p))، تحركية الثقوب (μ_p)، تحركية الثقوب (donor density of states (ν_p)، كثافة حزمة التكافؤ . donor or acceptor defects ν_p 0، كثافة عنطاق التوصيل (ν_p 1) valence band density of states (ν_p 1).

$MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$ الجدول الخلية الشمسية الخاصة لمحاكاة الخاصة الح

Parameter	MoS ₂	сzтѕ	CdS	ZnO	i– ZnO	ZnO:Al
Thickness (nm)	100	2500	80	80	100	200
Band gap (eV)	1.7	1.45	2.4	3.3	3.3	3.3
Electron affinity (eV)	4.2	4.5	4.2	4.6	4.4	4.6
Dielectric permittivity	13.6	10	9	9	9	9
CB effective density of states (cm ⁻³)	2.2E+18	2.2E+18	2.2E+19	2.2E+19	2.2E+18	2.2E+18
VB effective density of states (cm ⁻³)	1.8E+19	1.8E+19	1.8E+18	1.8E+19	1.8E+19	1.8E+19
Electron thermal velocity (cms ⁻¹)	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7
Hole thermal velocity (cms ⁻¹)	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7
Electron mobility (cm²/V _s)	100	100	100	100	100	100
Hole mobility (cm²/V _s)	25	25	25	25	25	25
Shallow uniform donor density, N _D (cm ⁻³)	0	0	3.0E+16	1.0E+14	1.0E+18	1.0E+18
Shallow uniform acceptor density, N(cm ⁻³)	1.0E+16	1.0E+17	1.0E+1	1.0E+1	1.0E+18	0
Defect type	-	Donor	Acceptor	Acceptor	Acceptor	Acceptor

كما تم مقارنة الخلية الأساس التي تم تصميمها مع الخلايا المختلفة، إذ تبين إن أفضل النتائج كانت مع الخلية التي تم المحصول عليها هي خلية (2). (2).



College of Basic Education Researchers Journal

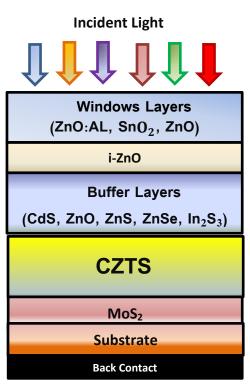
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

الجدول (2) معلمات الإخراج للخلايا المختلفة

Thin film solar cell	Efficiency(%)	Fill Factor (%)	J _{sc} (mA/cm ²)	V _{oc} (V)
Mo/CZTS/CdS/i-ZnO/Zno:Al	23.00	70.29	29.5356	1.1074
Mo/CZTS/ZnO/i-ZnO/ZnO:Al	25.55	85.77	28.6459	1.0397
Mo/CZTS/ZnS/ i-ZnO/ZnO:Al	26.37	88.41	28.1390	1.0595
Mo/CZTS/In ₂ S ₃ /i-ZnO/ZnO:Al	21.13	77.29	26.6775	1.0642
Mo/CZTS/ZnSe/i-ZnO/ZnO:Al	20.50	68.68	28.6653	1.0410

النتائج والمناقشة:

من أجل تحسين مخرجات الخلية الأساس $MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$ ، تم محاكاة كلاً من الطبقات CdS, ZnO, Window Layers النافذة $(ZnO, SnO_2, ZnO:AL)$ Window Layers)، والشكل (2) يوضح الخلية والطبقات المقترحة النافذة والعازلة.



...



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

A- دراسة تأثير إختبار الطبقة المثلى في الطبقات العازلة للخلية الأساس:

من أجل وضع الطبقة المثلى للخلية الأساس MoS₂/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL من الطبقات العازلة، فقد إقترح بديل لطبقة كبريتيد الكادميوم (CdS). إذ تم إختبار طبقات عازلة مثل كبريتيد الزنك (ZnSe) وسيلينيد الزنك (ZnSe)، تقارن وكبريتيد الإنديوم (InS) وأوكسيد الزنك (ZnS) مع (CdS). فكانت النتائج التي تم الحصول عليها بإستخدام (ZnS)، تقارن بشكل إيجابي مع نتائج CdS، عليه فان الطبقة (ZnS) وبشمك (μm) التي تعتبر من أفضل البدائل المرشحة كمواد عازلة للخلية الشمسية الأساس، وكما مبين في الشكل(3).

B- دراسة تأثير إختبار الطبقة المثلى في الطبقات النافذة للخلية الأساس:

ومن أجل وضع الطبقة المثلى للخلية الأساس $MoS_2/CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL$ من الطبقات النافذة، وقد إقترح بديلاً لطبقة (ZnO:AL). إذ تم إختبار طبقات نافذة مثل (SnO_2) و (SnO_2). كانت النتائج التي تم الحصول عليها بإستخدام (ZnO:AL) التي يمكن مقارنتها إيجابياً، عليه فان الطبقة (ZnO:AL) وبسُمك (ZnO:AL) التي تعتبر من أفضل البدائل المرشحة كمواد نافذة للخلية الشمسية الأساس، وكما مبين في الشكل(ZnO:AL).

كما تم في هذه الدراسة تغيير سُمك طبقة الإمتصاص Absorber Layer من (0.5 –3.5 μ m) من أن أفضل shallow uniform acceptor (NA) سُمك كان (1.5 μ m) المحصول على افضل كفاءة، مع اعتماد تركيز الشوائب (1.5 μ m) المحصول على افضل كفاءة، مع اعتماد تركيز الشوائب (1.5 μ m) المحتمدة الخلية المعتمدة في هذه الدراسة.

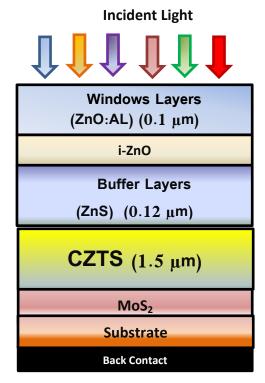
تم الحصول على مجموعة من النتائج الجيدة عندما كان أفضل سُمك لطبقة الامتصاص(CZTS) هو (1.5μm)، وأن أفضل سُمك للطبقة النافذة (ZnO:AL) كان (2.1μm)، إذ تم تطبيق هذه الأسماك في الخلية المعدلة التي تم إعتمادها وكانت مخرجاتها هي كما يأتي:

(Voc =1.0596V, Jsc=28.1390mA/cm², FF=88.41%, η =26.37%)



College of Basic Education Researchers Journal

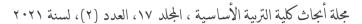
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)



الشكل (3) الهيكل التخطيطي للخلية المعدلة من الخلية الأساس.

- دراسة تأثير سُمك الطبقة النافذة (ZnO:AL) على الخواص الكهربائية للخلية الشمسية:

تُعد طبقة (ZnO:AL) من أكثر الطبقات شيوعاً التي يمكن إستخدامها في العديد من التطبيقات، إذ درس العديد من الباحثين هذه الطبقة في تطبيقات الإلكترونيات[12]. يُستحسن دائماً أن تكون هذه الطبقة أرق من طبقة الإمتصاص لزيادة إمتصاص الإشعاع الشمسي الوارد (الفوتونات) الى طبقة (P-CZTS)، إذ تم تغيير سُمك طبقة (ZnO:AL) من ((الفوتونات) الى طبقة (الكرى للوصول إلى أفضل سُمك، إذ تبين أن زيادة سُمك الطبقة النافذة(ZnO:AL) لهُ آثار سلبية على مخرجات الخلية، إذ تبين أنه بزيادة سُمك الطبقة النافذة(ZnO:AL) فأن قيمة فولتية الدائرة المفتوحة (Voc) تقل، كما في الشكل (a-b)، أما بالنسبة لد تيار دائرة القصر Jsc ،فأنه بزيادة سُمك الطبقة النافذة (ZnO:AL) أيضاً يقل، نتيجة أزدياد إعادة الإلتحام عند السطح، كما في الشكل (a-b)، أما بالنسبة لد عامل المليء FF فانه يقل أيضاً لإمتلاك طبقة (ΔnO:AL) مناومة وتشويب عالي، كما في الشكل (a-b)، أما عن كفاءة الخلية الشمسية فأنه يلاحظ إنخفاض قيمة الكفاءة (β) بزيادة سُمك الطبقة النافذة (ZnO:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الطبقة النافذة (ZnO:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الطبقة النافذة (ZnO:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة المنافذة (CZTS)، وبذلك تزداد عملية إعادة المنافذة (Zno:AL)، النافذة (Zno:AL)، نتيجة إنخفاض وصول الفوتونات الى طبقة الإمتصاص (CZTS)، وبذلك تزداد عملية إعادة المنافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة النافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة النافذة (المنافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الخلية النافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الخلية النافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الخلية النافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة المنافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الخلية الشعب المنافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة الخلية المنافذة (Zno:AL)، وبذلك الطبقة الإعادة الخلية المنافذة (Zno:AL)، وبذلك تزداد عملية إعادة المنافذة (Zno:AL) وبذلك الطبقة الإعادة الخلية المنافذة (Zno:AL) والمنافذة (Zno

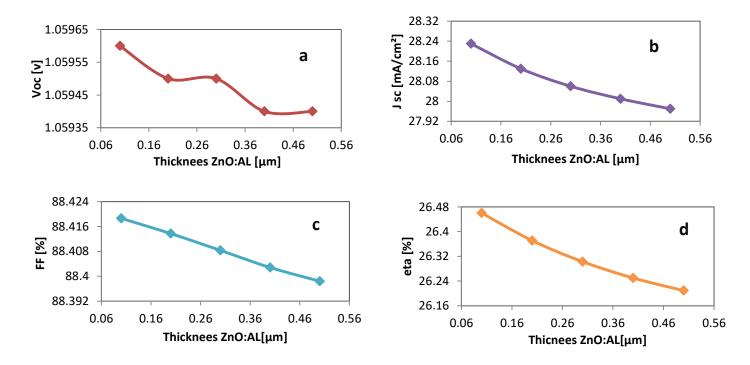




College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

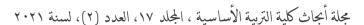
الإلتحام، ويقل معدل توليد الزوج (إلكترون-فجوة)، تبين أنه بزيادة سُمك طبقة (ZnO:AL)، فأن مخرجات الخلية الشمسية تقل، كما في الشكل(A-d).



الشكل (4) تأثير سُمك طبقة ZnO:AL على الخصائص الكهربائية للخلية الشمسة

D- دراسة تأثير سُمك الطبقات العازلة (Buffer Layers) على كفاءة الخلية الشمسية:

تم دراسة تأثير سُمك الطبقات العازلة على كفاءة الخلية الشمسية. وتم تغيير سُمك الطبقات العازلة المختلفة من (Jsc) بزيادة سُمك الطبقات العازلة، فان مقدار (Jsc) يقل، وتحدث زيادة بسيطة قريبة من الثبوت في مقدار (Voc)، ويزداد عامل المليء (FF)، لأن الطبقات العازلة (BL) تعمل على تقليل عملية إعادة الإلتحام فيزداد عامل المليء (FF)، وزيادة سُمكها يزيد من إمتصاص الفوتونات الساقطة عليها فيقل Jsc، لذلك ستنتج أزواج أقل من الإلكترون- دووت لعوق المعلى المعلى المؤتونات المأتقطة بواسطة طبقة الإمتصاص Absorber Layer وتم الحصول على كفاءة مثلى لطبقة (ZnS) عند سُمك (0.12μm). فقد تؤدي الطبقات العازلة (BL)

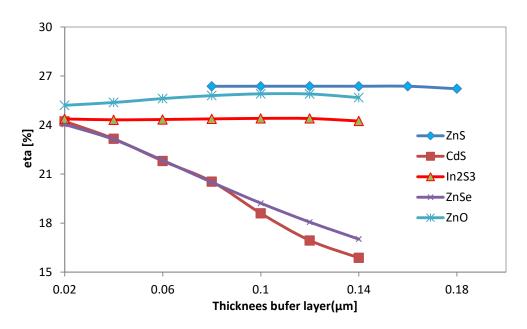




College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

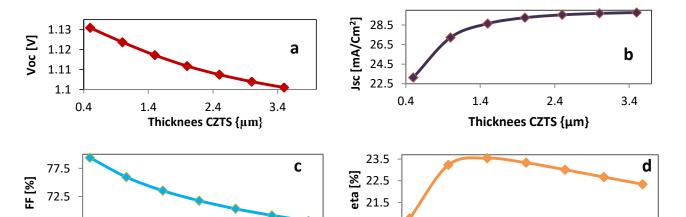
السميكة إلى إمتصاص الفوتونات الداخلة، وتؤدي الطبقات الرقيقة إلى تسرب التيار، نستنتج أن الكفاءة تقل بزيادة سُمك الطبقة العازلة(BL)، وكما مبين في الشكل (5).



الشكل (5) تأثير سُمك الطبقات العازلة على كفاءة الخلية الشمسية

E دراسة تأثير سُمك طبقة الإمتصاص (CZTS) على الخواص الكهربائية للخلية الشمسية:

تمتلك طبقة إمتصاص (CZTS) إمتصاصية عالية أكبر من 10⁴ cm⁻¹ بذلك يمكن تحقيق كفاءة عالية وبتكلفة أقل, وقد تم إختبار طبقة الإمتصاص من (0.5-3.5µm) للحصول على أفضل, حيث تم دراسة تأثير تغيير سُمك طبقة الإمتصاص P-CZTS مع ثبوت جميع المعلمات المثبتة في الجدول) (1) والشكل (6-a) يوضح تأثير تغيير سُمك طبقة الإمتصاص على (Voc), إذ نقل (Voc) بسبب زيادة إحتمالية إعادة الإلتحام نتيجة زيادة تيار التشبع العكسي المتولد في منطقة الاستنزاف.





College of Basic Education Researchers Journal

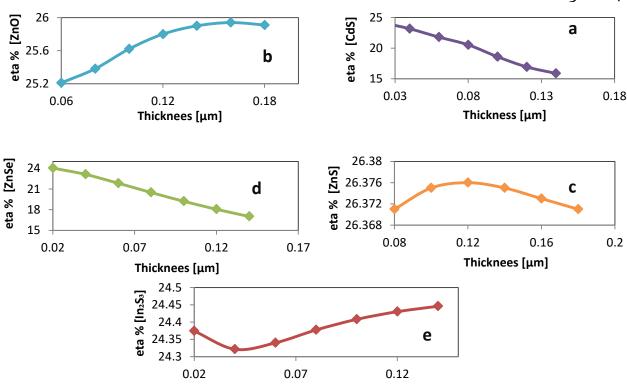
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

أما عن كثافة تيار دائرة القصر Jsc، إذ يلاحظ حصول إزدياد حاد واضح لقيم Jsc نتيجة زيادة إعادة الإلتحام والإمتصاص غير المتكامل للفوتونات عندما كان سُمك طبقة الإمتصاص أقل من 1.5μm، أما بزيادة سُمك طبقة الإمتصاص أكثر من الفوتونات العاقطة الإمتصاص مقدار أكبر من الفوتونات الساقطة الشكل (6-b) يوضح هذا الأمر.

أما عامل المليء FF فان تغيير سُمك طبقة الإمتصاص CZTS فان تأثيره يكون حاداً عند السُمك FF، أما بعد السُمك FF، أما بعد السُمك 1.5µm يحصل إنخفاضاً بسيطاً نتيجة لإزدياد عملية إعادة الإلتحام فيقل بذلك Voc، والشكل (6-c) يبين وضح ذلك.

أما عن كفاءة الخلية الشمسية η فان زيادة معدل توليد الزوج (إلكترون- فجوة) فان الكفاءة تزداد بزيادة سُمك طبقة الإمتصاص نتيجة زياد كثافة تيار دائرة القصر Jsc، لكن هذه الزيادة تصل ذروتها عند السُمك 1.5μm. إذ يتم إمتصاص الفوتونات الساقطة عند أعماق مختلفة من الخلية، نتيجة لزيادة إعادة الإلتحام في الأطوال الموجية القصيرة وإنخفاض معامل الإمتصاص، فأن الكفاءة تبدأ بالإنخفاض بعد السُمك 1.5μm والشكل (6-d) يبين ذلك.

من خلال هذه الدراسة تم الكشف أن كفاءة الخلية تتغير بتغير سُمك طبقة الإمتصاص ولكن لديها زيادة أبطأ عندما يزيد سُمك طبقة الإمتصاص عن 1.5µm، لأن ذلك سيزيد من معدل إعادة الإلتحام وهذا السُمك كافٍ لإمتصاص معظم الفوتونات الساقطة. ويتطلب الحصول على طبقة عازلة رقيقة وطبقة إمتصاص سميكة، والشكل(7) يبين تأثير سُمك الإمتصاص للطبقات العازلة المختلفة.



Thickness [μm] الشمسية (e) – In₂S₃) – (d) ZnSe–(c)ZnS–(b)ZnO–(a)CdS) على كفاءة الخلية الشمسية الشمسية الشمسية المعادلة المع



College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

الإستنتاج:

من خلال دراسة الخلية الشمسية الأساس (MoS $_2$ /CZTS/CdS/i-ZnO/ZnO:AL)، كانت كفاءتها (23.00%)، وكانت كفاءتها (23.00%)، كما تم تغيير الطبقات العازلة Buffer Layers تم تغيير الطبقات النافذة (ZnO:AL, SnO $_2$, ZnO) Window Layers)، وكذلك تم تغيير شمك طبقة الإمتصاص(CZTS)، إذ تبين من هذه الدراسة أن:

تم إختيار طبقة (ZnO:AL) كأفضل طبقة نافذة، إذ تبين انه بزيادة سُمك الطبقة النافذةWindow Layers فان مخرجات الخلية الشمسية تقل، وإن أفضل سُمك كان (0.1µm)،

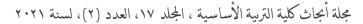
كما تم إختيار طبقة (ZnS) كأفضل طبقة عازلة، إذ تبين أنه بزيادة سُمك الطبقة العازلة الماكثافة تيار دائرة ولا المليء يزداد بزيادة سُمك الطبقة العازلة، أما كثافة تيار دائرة القصر (Voc)، ينخفض قليلاً ثم يرتفع إرتفاعاً حاداً عند سُمك (1.4 µm)، أما كفاءة الخلية الشمسية تصل ذروتها عند سُمك (1.5µm) ثم تقل، نستنج من ذلك أن الكفاءة تقل بزيادة سُمك الطبقة العازلة.

إذ تبين بتغيير سُمك طبقة الإمتصاص من (μm ° ۳.۰ ° ۰.۰)، تم الحصول على أفضل كفاءة بلغت ((23.5%) عند سمك (1.5μm).

تم إختيار الخلية (MoS2/CZTS/ZnS /i-ZnO/ZnO:AL)، وتم الحصول على كفاءة مثلى بلغت (26.37%)، إذ تم حصولنا على أفضل كفاءة من خلال إختيار أفضل الطبقات النافذة والعازلة وإختيار السمك الأمثل لطبقة الإمتصاص.

References:

- 1- S. C. Riha, B. A. Parkinson, and A. L. Prieto, "Solution-based synthesis and characterization of Cu₂ZnSnS₄ nanocrystals," Journal of the American Chemical Society, vol. 131, no. 34, pp. 12054–12055, 2009.
- 2- C. Steinhagen, M. G. Panthani, V. Akhavan, B. Goodfellow, B. Koo, and B. A. Korgel, "Synthesis of Cu_2ZnSnS_4 nanocrystals for use in low-cost photovoltaics," Journal of the American Chemical Society, vol. 131, no. 35, pp. 12554–12555, 2009.
- 3- S. R. Hall, J. T. Szymanski, and J. M. Stewart, "Kesterite Cu₂(Zn,Fe)SnS₄ and stannite Cu₂(Fe,Zn)SnS₄ structurally similar but distinct minerals," The Canadian Mineralogist, vol. 16, pp. 131–137, 1978.





College of Basic Education Researchers Journal

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)

- 4- Nitsche, R.; Sargent, D. F.; Wild, P. "Crystal Growth of Quaternary I(2)II-IV-VI(4) Chalcogenides by Iodine Vapor Transport". Journal of Crystal Growth. 1:pp, 52-53, 1967.
- 5- K. Ito and T. Nakazawa, "Electrical and Optical Properties of Stannite-Type Quaternary Semiconductor Thin Films". Japanese Journal of Applied Physics. **27,no** 11, pp. 2094–2097, 1988.
- 6- Katagiri, Hironori; Jimbo, Kazuo; Maw, Win Shwe; Oishi, Koichiro; Yamazaki, Makoto; Araki, Hideaki; Takeuchi, Akiko "Development of CZTS-based thin film solar cells". Thin Solid Films. **517** (7): 2455-2460. (2009).
- 7- S. Chen, A. Walsh, Y. Luo, J.-H. Yang, X. G. Gong, and S.-H. Wei, "Wurtzite-derived polytypes of kesterite and stannite quaternary chalcogenide semiconductors," Physical Review B, vol. 82, no. 19, Article ID 195 203, 2010.
- 8- Z. Yang, Research on one-step Preparation of CZTS films and electrochemical optical properties [M.S. thesis], Dalian University of Technology, 2011.
- 9- N. Momose, M. T. Htay, T. Yudasaka et al., "Cu₂ZnSnS₄ thin film solar cells utilizing sulfurization of metallic precursor prepared by simultaneous sputtering of metal targets," Japanese Journal of Applied Physics, vol. 50, no. 1, Article ID 01BG09, 2011.
- 10- M. Burgelman, P. Nollet, S. Degrave, Modelling polycrystalline semiconductor solar cells, Thin Solid Films, 361, pp, 527-532, 2000.
- 11- K.wok, K..Ng, "Complete guide to Semiconductor Devices", U.S.A. (1995).
- 12- L. Znaidi, T. Touam, D. Vrel et al., "ZnO thin films synthesized by sol-gel process for photonic applications," Acta Physica Polonica A, vol. 121, no. 1, pp. 165-168, 2012.